

УДК 538.22

©1994

ВЛИЯНИЕ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ ТРИГОНАЛЬНОЙ СИММЕТРИИ НА СПЕКТР ФЕРРОМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА РТУТНОЙ ШПИНЕЛИ

Н.И.Солин, Л.Д.Фальковская, А.А.Самохвалов

Проведены экспериментальное и теоретическое исследования ферромагнитного резонанса в ртутной шпинели. На угловой зависимости ширины линии наблюдаются максимумы в направлениях [112], [111] и [110]. Обнаружено аномальное поведение температурных зависимостей резонансного поля и ширины линии вдоль трудных осей [112] и [110] в низкотемпературной области 4.2–30 К. Эти результаты могут быть объяснены присутствием в кристалле двух типов примесных центров — кубической и тригональной симметрии. Роль таких центров играют комплексы ионов хрома смешанной валентности, образованные переносом лишнего электрона или дырки вблизи вакансии или неизовалентной примеси замещения.

Исследования ферромагнитного резонанса (ФМР) позволили понять в основных чертах природу магнитной анизотропии и релаксации в хром-халькогенидных шпинелях (XXIII) [1–3]. Ионы Cr^{3+} , образующие магнитную структуру в этих соединениях, в кубическом кристаллическом поле имеют замороженный орбитальный момент и дают малый вклад в анизотропию и ширину линии ФМР ΔH . Значительная кристаллографическая анизотропия, наблюдаемая в них, объясняется присутствием орбитально вырожденных примесных центров, главным образом ионов Cr^{2+} и Cr^{4+} . При этом магнитная анизотропия и процессы релаксации при ФМР в HgCr_2Se_4 обладают рядом интересных особенностей [4,5]. Основные из этих особенностей следующие: а) большие значения ΔH и параметра затухания спиновых волн (более 30 Ое), б) одновременное наличие максимумов угловой зависимости ΔH вдоль двух кристаллографических направлений: [111] и [100], в) температурные зависимости ΔH вдоль этих направлений имеют максимумы приблизительно при одинаковой температуре $T = 13 \div 17$ К, г) немонотонное изменение кристаллографической анизотропии H_{res} с температурой и сохранение анизотропии вплоть до температуры Кюри $T_c = 106$ К. Кроме того, сообщалось о наблюдениях анизотропии типа одноосной [6–8]. Природа этих особенностей неясна. Можно ожидать, что они связаны с несовершенством кристалла. Действительно, на более качественных кристаллах HgCr_2Se_4 с параметром затухания спиновых волн $2\Delta H_k \simeq 1$ Ое наблюдались обычные для XXIII угловые и температурные зависимости анизотропии [9,10].

В настоящей работе сообщаются результаты исследований ФМР монокристалла HgCr_2Se_4 , в котором температурные зависимости резонансного поля и ширины линии имеют перечисленные выше особенности. Однако максимумы на угловой зависимости ширины линии имеют место при трех кристаллографических направлениях намагниченности: [112], [111] и [110]. Полученные результаты обсуждаются с использованием эффективного гамильтонiana примесного центра с учетом особенностей симметрии шпинельной структуры. Показано, что для объяснения основных особенностей магнитной анизотропии и затухания магнитных волн в исследованных образцах необходимо учитывать перенос заряда и случайные кристаллические поля. Расчеты удовлетворительно согласуются с экспериментом.

1. Образцы и методика эксперимента

Исследования ФМР проведены на частоте 9.4 GHz в интервале температур 4.2–100 K. Хорошо полированные ориентированные в плоскости (110) относительно магнитного поля сферы помещались в пучность магнитного поля в центре прямоугольного проходного резонатора H_{102} . Ориентировка образцов проводилась рентгеновским методом. Было сконструировано приспособление, позволяющее перенести образец в резонатор при фиксированном с точностью до 2–3° направлении осей. Линии поглощения и значения напряженности магнитного поля (с точностью до 2 Oe) записывались на двухкоординатном самописце. Значения ΔH определялись по методике [11]. Из центральной и вершинной частей монокристалла с формой тетраэдра, приготовленного по технологии [12], изготавливались две сферы: № 1 с диаметром $d = 1.36$ mm и № 2 с диаметром $d = 0.46$ mm. Электропроводность образцов имела полупроводниковый характер с p -типов носителей в парамагнитной и n -типов носителей в ферромагнитной областях. Значения электропроводности σ и диэлектрической проницаемости ϵ' на частоте 9.4 GHz составляли $\sigma = 2 \cdot 10^{-4} \Omega^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$ и $\epsilon' = 15$ при $T = 77$ K.

2. Результаты

Угловые зависимости ΔH и H_{res} при 4.2 K представлены на рис. 1, 2, а температурные зависимости ΔH и H_{res} — на рис. 3, 4. Для образца № 1 все кривые имеют характерный для ХХIII вид: резкие пики на угловых зависимостях ΔH и H_{res} вдоль [111] при температуре 4.2 K и монотонное уменьшение анизотропии ΔH и H_{res} с ростом температуры. Для образца № 2 наблюдаются два дополнительных пика на угловой зависимости ΔH — в направлениях [112] и [110]. Кроме того, у этого образца намного больше не зависящий от угла вклад в ΔH («постамент»; рис. 1) и больше ширина пиков в угловой зависимости ΔH . Видна также асимметрия угловых зависимостей ΔH и H_{res} относительно оси [110]. Уменьшение кристаллографической анизотропии в образце № 2 по сравнению с образцом № 1 характеризуется главным образом снижением H_{res} вдоль оси [111], в то время как разность резонансных полей в направлениях [001] и [110] заметно не изменилась. При этом для образца № 2 значения H_{res} значительно ниже, чем для образца № 1 во всем температурном интервале, особенно при низких

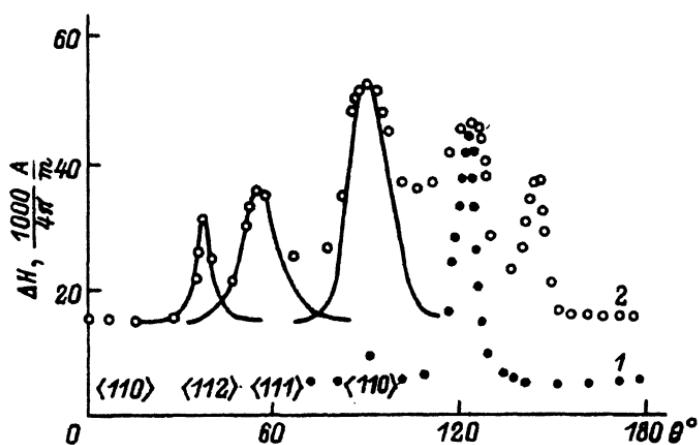


Рис. 1. Угловые зависимости ширины линии ФМР образцов $HgCr_2Se_4$ № 1 и 2 при 4.2 К.

Точки — эксперимент, сплошные кривые — расчет при $\delta_c = 19$ К, $n_c = 1.4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и $\Delta_c = 1$ К для образца № 1 и $\delta_c = 19$ К, $\delta_t = 100$ К, $n_c = 1.4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$, $n_t = 2.3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, $\Delta_c = 5$ К, $\Delta_t = 10$ К, $\omega A^c = 50 \text{ К}^3$, $\omega A^t = 1000 \text{ К}^3$ для образца № 2.

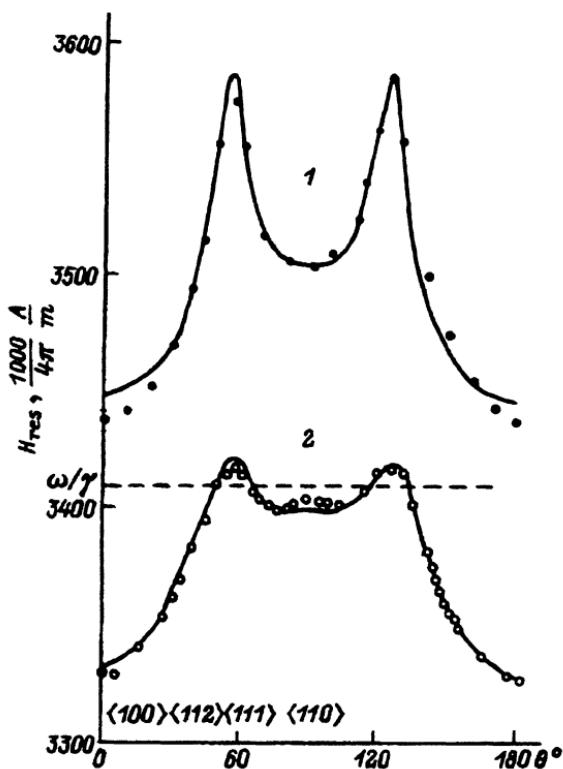


Рис. 2. Угловые зависимости резонансного поля образцов $HgCr_2Se_4$ № 1 и 2 при 4.2 К.

Точки — эксперимент, сплошные кривые — расчет.

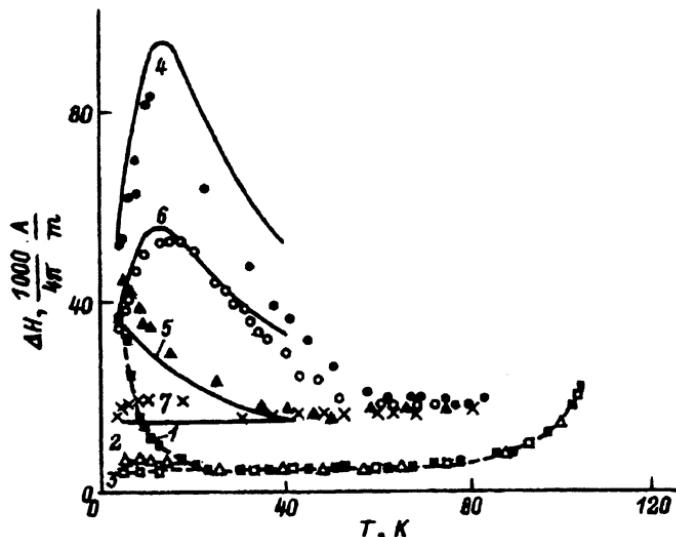


Рис. 3. Температурные зависимости ширины линии ФМР образцов HgCr_2Se_4 вдоль некоторых кристаллографических направлений.

Точки — эксперимент, сплошные кривые — расчет. 1–3 — экспериментальные данные для образца № 1 вдоль направлений [111], [110] и [001] соответственно; 4–7 — для образца № 2 вдоль направлений [110], [111], [112] и [001] соответственно.

температурах (рис. 4), а анизотропия H_{res} сохраняется до более высоких температур. Для образца № 2 характер температурной зависимости ширины линии ФМР вдоль оси [111] не изменился по сравнению с образцом № 1: значения ΔH монотонно, но заметно медленнее убывают с ростом температуры (рис. 3).

Впервые анизотропия параметров ФМР такого типа с максимумами ΔH вдоль осей [112], [111] и [110] наблюдалась в CdCr_2S_4 [3]. Результаты были объяснены вкладом случайных примесей Fe^{2+} в тетраузлах и изолированных ионов Cr^{2+} в октаузлах. Рассмотрим возможную природу анизотропии ФМР HgCr_2Se_4 более подробно.

3. Модель примесного центра

Обычно особенности спектров ФМР в XXIII объясняются появлением в кристалле изолированных ионов неосновной валентности Cr^{2+} или Cr^{4+} вблизи вакансии или примеси замещения [1,2]. При интерпретации экспериментальных данных по угловым зависимостям резонансного поля и ширины линии предполагается, что минимальная величина H_{res} в направлениях [001]-типа и максимальная величина ΔH в направлениях [111]-типа обусловлены центрами Cr^{2+} , а минимальная величина H_{res} вдоль осей [111] и максимальные значения ΔH вдоль осей [100] и [110] связываются с центрами Cr^{4+} . Свойства изолированных центров Cr^{2+} и Cr^{4+} должны качественно отличаться от указанных прежде всего потому, что такие изолированные ионы не могут сохранить необходимую степень вырождения из-за наличия источника избыточного заряда в их ближайшем окружении. Кроме того, описанные выше особенности спектра ФМР можно было бы связать с изолированными

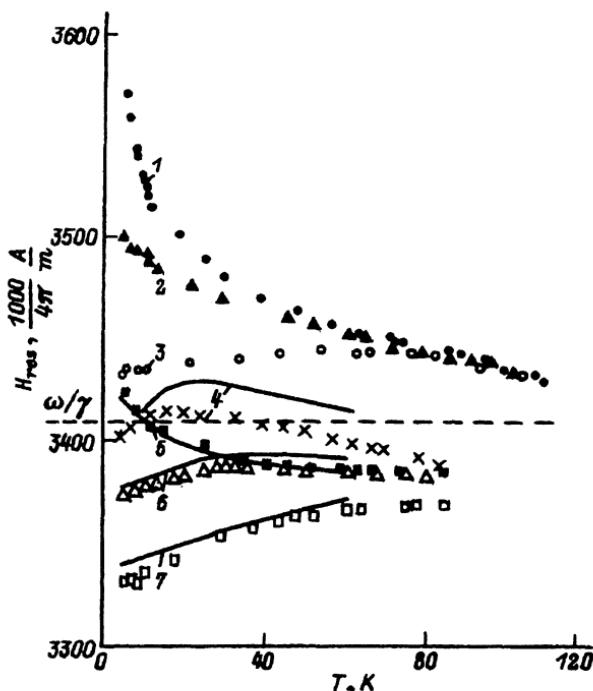


Рис. 4. Температурные зависимости резонансного поля образцов HgCr_2Se_4 вдоль некоторых кристаллографических направлений.

Точки — эксперимент, сплошные кривые — расчет. 1–3 — для образца № 1 вдоль направлений [111], [110] и [001] соответственно; 4–7 — для образца № 2 вдоль направлений [110], [111], [112] и [001] соответственно.

ионами Cr^{2+} , если бы локальная симметрия окружения этих ионов была кубической. Однако известно [3], что симметрия окружения иона хрома в октапозиции шпинели содержит заметную тригональную компоненту. В работах [13, 14] показано, что эти противоречия снимаются, если учесть возможность переноса избыточного заряда между ионами хрома.

Если при выращивании или отжиге кристалла возникает вакансия Se или Cr в одном из октаузлов шпинельной решетки (рис. 5), то примесный центр представляет собой комплекс из трех ближайших к вакансии ионов Cr^{3+} (с номерами 1, 2 и 3), между которыми переносится избыточный электрон или дырка. Такой примесный центр обладает тригональной симметрией. Очевидно, что эти центры могут дать существенный вклад в H_{res} и ΔH , если их основное состояние орбитально вырождено. Для кластеров тригональной симметрии это может быть только тригональный E -терм. Его расщепление в поле анизотропии при заданном направлении намагниченности можно описать модельным эффективным гамильтонианом [14]

$$H = \delta_t \sigma_y (-\alpha_x + \alpha_y + \alpha_z) + \delta_1 [\sigma_z (3\alpha_z^2 - 1) + \sqrt{3} \sigma_x (\alpha_x^2 - \alpha_y^2)] + \\ + \delta_2 [\sigma_z (2\alpha_x \alpha_y - \alpha_x \alpha_z + \alpha_z \alpha_y) + \sqrt{3} \sigma_x (\alpha_x \alpha_z + \alpha_z \alpha_y)]. \quad (1)$$

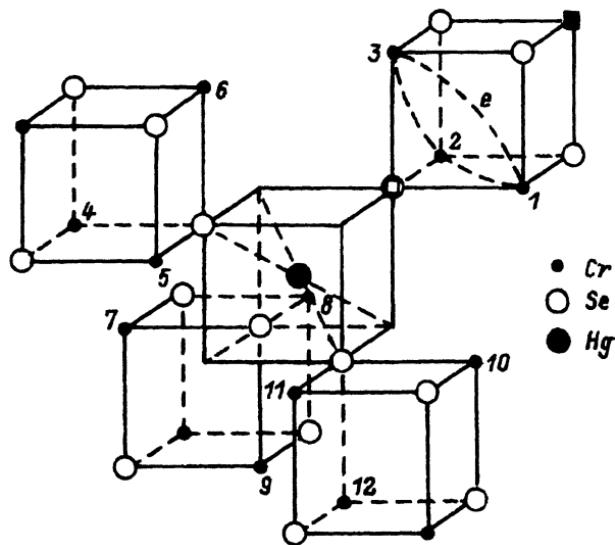


Рис. 5. Расположение ионов в решетке ртутной шпинели.

Здесь α_i ($i = x, y, z$) — направляющие косинусы намагниченности; $\sigma_{x,y,z}$ — матрица Паули; вид коэффициентов δ_t , δ_1 и δ_2 , выражающихся через параметр спин-орбитального взаимодействия λ и параметры кубического или тригонального кристаллического поля, определяется происхождением тригонального E -центра. Гамильтониан (1) записан для тригонального центра, связанного с осью $[1\bar{1}1]$ — одной из четырех тригональных осей кристалла.

Максимумы на угловой зависимости ширины линии наблюдаются при направлениях намагниченности, для которых энергия расщепления вырожденного уровня минимальна. При доминировании первого слагаемого в гамильтониане (1) расщепление дублетного уровня будет максимальным при направлении намагниченности вдоль собственной тригональной оси комплекса $[1\bar{1}1]$, а минимально — в плоскости, ей перпендикулярной (т. е., в частности, в направлениях $[112]$ и $[110]$). При доминировании двух других слагаемых расщепление минимально при намагниченности, направленной вдоль тригональной оси. Из экспериментальной угловой зависимости ΔH следует, что в гамильтониане (1) доминирует первое слагаемое, приводящее к следующему выражению для энергии расщепления дублетного уровня:

$$\Delta E^{\text{trig}} = 2\delta_t(-\alpha_x + \alpha_y + \alpha_z). \quad (2)$$

Другая возможность появления в кристалле ионов хрома неосновной валентности связана с примесью замещения иона ртути в тетрапозиции трехвалентным или одновалентным ионом. При этом ближайшими к замещенному иону оказываются 12 ионов хрома, образующие комплекс с симметрией груши T_d (рис. 5). В работах [13, 14] показано, что при замещении катиона в тетрапозиции как одновалентным, так и трехвалентным ионом основное состояние такого примесного комплекса может оказаться двукратно вырожденным с энергией расщепления

в поле магнитной анизотропии следующего вида:

$$\Delta E^{\text{cub}} = 2\delta_c \left(1 - 3f(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z)\right)^{1/2},$$

$$f(\alpha_x, \alpha_y, \alpha_z) = \alpha_x^2 \alpha_z^2 + \alpha_x^2 \alpha_z^2 + \alpha_y^2 \alpha_z^2. \quad (3)$$

В результате примесная анизотропия стабилизирует оси [001]-типа в качестве легких осей, а на угловой зависимости ΔH должны наблюдаться максимумы в направлениях [111]. Спектры ФМР такого типа были получены в [2] на образцах CdCr_2S_4 , легированных трехвалентными Gd или Ga. В той же работе показано, что при замещении Cd^{2+} одновалентным Ag^+ магнитная анизотропия примесной подсистемы характеризуется легкими тригональными осями [111]-типа и максимумы ΔH наблюдаются в направлениях [001] и [110]. Согласно [14], такие результаты могут быть объяснены в пределе слабого переноса, когда интеграл переноса заряда между магнитными катионами меньше параметра спин-орбитального взаимодействия.

В реальных системах всегда встречаются различные нарушения трансляционной инвариантности, связанные с дефектами кристаллической решетки, примесями, распределением катионов и т. д. Если дисперсия таких полей невелика по сравнению с характерными параметрами одноионной анизотропии примесного центра (δ_c или δ_t), то их учет оказывается существенным главным образом для направлений намагниченности, при которых нижайшее состояние почти вырождено. Для центров кубической (тетраэдрической) симметрии усреднение величин ΔH и H_{res} по случайнм полям проводились с использованием двумерной гауссовой функции распределения [5].

При анализе вклада в спектр ФМР центров тригональной симметрии учитывались для простоты лишь случайные поля следующего вида [16]:

$$H_{\text{random field}} = h\sigma_y. \quad (4)$$

Для случайных полей магнитоупругой природы h может быть записано следующим образом:

$$h = V \left(\alpha_x e_{E\theta} + \alpha_y e_{E\varepsilon} \right), \quad (5)$$

где V — параметр магнитоупругого взаимодействия; направляющие косинусы намагниченности отсчитываются в тригональном базисе; $e_{E\theta}$, $e_{E\varepsilon}$ — ян-теллеровски активные E_g -деформации для тригонального E -терма.

Соответствующие выражения для вкладов тригональных центров в H_{res} и ΔH необходимо усреднить с использованием гауссовой функции распределения одномерных случайных полей

$$g^{\text{trig}}(h) = (\sqrt{\pi} \Delta_t)^{-1} \exp(-h^2 / \Delta_t^2), \quad (6)$$

где Δ_t — дисперсия случайных полей тригональной симметрии.

4. Обсуждение результатов

Расчет параметров ФМР образца № 2 был проведен в предположении, что в нем имеются центры смешанной валентности как тригональной, так и кубической симметрии.

Вклады центров обоих типов в ширину линии ФМР вычислялись в приближении теории медленной (продольной) релаксации [17]. При этом считалось, что время релаксации двухуровневого центра определяется в основном однофононными процессами (см., например, [15])

$$\tau = A \operatorname{th} \left(\Delta E / (2k_B T) \right) / (\Delta E / 2)^3, \quad (7)$$

где A — параметр теории; ΔE — энергия расщепления либо тригонального, либо кубического центра.

Расчет значений резонансного поля проводился с учетом статического $H_{\text{res}}^{\text{stat}}$ и динамического $H_{\text{res}}^{\text{dyn}}$ вкладов от центров обоих типов. Выражение для $H_{\text{res}}^{\text{stat}}$ общеизвестно [18] и потому не приводится. Динамический вклад в H_{res} , как следует из теории медленной релаксации, отрицателен и связан с теоретическим значением ΔH соотношением [17, 19]

$$H_{\text{res}}^{\text{dyn}} = -\omega \tau \Delta H, \quad (8)$$

где ω — угловая частота. Именно этот вклад позволил объяснить аномалии температурной зависимости H_{res} в ртутной шпинели в области низких температур [4, 20].

Мы подобрали такие значения $\delta_c = 19$ К для кубического и $\delta_t = 100$ К, $\delta_1 = \delta_2 = 0$ для тригонального центров, их концентраций $n^c = 1.4 \cdot 10^{18}$ и $n^t = 2.3 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, дисперсий случайных полей $\Delta_c = 5$ и $\Delta_t = 10$ К и параметров $\omega A^c = 50$ и $\omega A^t = 1000 \text{ К}^3$ в выражении (7), чтобы они удовлетворительно описывали экспериментальные результаты по угловой и температурной зависимостям ΔH и H_{res} образца № 2. При этом учитывалось наличие в ΔH изотропной слабо зависящей от температуры части $\Delta H_0 \cong 15$ Ое, обусловленной несовершенством кристалла. Результаты расчетов представлены на рис. 1–4 сплошными кривыми.

Максимумы ΔH вдоль направления [111] обусловлены вкладом центров кубической симметрии. В случае образца № 1 этот вклад в анизотропию является преобладающим. Для аналогичных образцов в [9] было показано, что угловая и температурная зависимости ΔH и H_{res} могут быть объяснены присутствием примесных центров кубической симметрии. Экспериментальная угловая зависимость H_{res} образца № 1 удовлетворительно описывается при следующем наборе параметров: $\delta_c = 19$ К, $n_c = 1.4 \cdot 10^{18} \text{ см}^{-3}$ и $\Delta_c = 1$ К. Из сравнения этого набора с соответствующими параметрами центров кубической симметрии образца № 2 видно, что изменилась лишь дисперсия случайного поля. Следует отметить, что помимо перечисленных выше статического и динамического вкладов в H_{res} существует еще вклад, вызванный эффектом электромагнитного распространения, зависящий от размера образца [19]

$$H_{\text{res}}^{\text{em}} = 4\epsilon' \cdot 4\pi M(\omega d/c)^2 / 45, \quad (9)$$

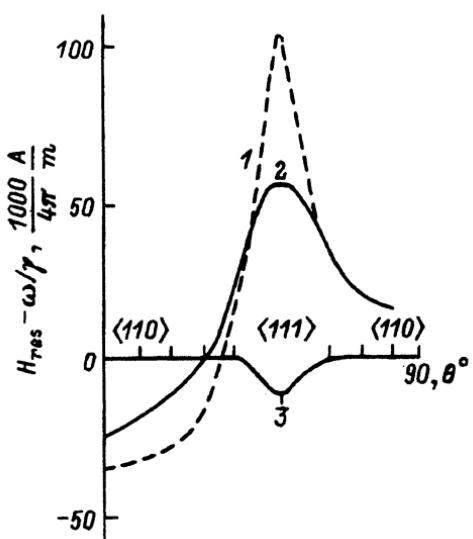


Рис. 6. Вклад центров кубической симметрии в анизотропию H_{res} ртутной шпинели при 4.2 К.

1 — статический вклад для образца № 1, 2 — статический и динамический вклады для образца № 2.

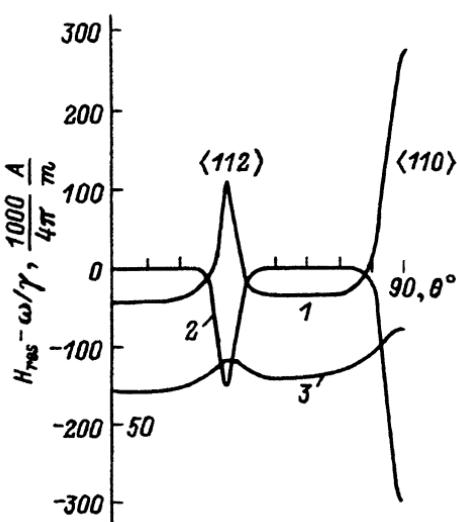


Рис. 7. Вклад центров тригональной симметрии в анизотропию H_{res} HgCr_2Se_4 при 4.2 К для образца № 2.

1 — статический вклад, 2 — динамический вклад, 3 — сумма статического и динамического вкладов (правая шкала).

где M — намагниченность насыщения, d — диаметр образца, c — скорость света. Температурная зависимость этого вклада для образца № 1 изображена кривой 5 на рис. 8 для $\epsilon' = 15$. Если теперь учесть постоянный положительный сдвиг H_{res} образца № 1 по сравнению с образцом № 2, то из рис. 2 видно, что увеличение дисперсии случайных полей приводит к уменьшению H_{res} в основном вдоль направления пересечения уровней [111]. В остальном характер зависимостей H_{res} и ΔH с увеличением дисперсии не изменился: анизотропия H_{res} и ΔH монотонно уменьшается в увеличении температуры.

Максимумы ΔH вблизи направлений [112] и [110] связаны с центрами тригональной симметрии в кристалле. Согласно теории медленной релаксации, анизотропные части (за вычетом «постамента») ΔH вдоль осей [112] и [110] должны отличаться в два раза при всех температурах, а температурные зависимости ΔH для этих двух направлений должны иметь максимум при одинаковой температуре, как и наблюдается на эксперименте. Статический и динамический вклады в угловую зависимость резонансного поля при $T = 4.2$ К от центров кубической и тригональной симметрии приведены на рис. 6, 7 соответственно. Видно, что динамический вклад в H_{res} от центров кубической симметрии мал, а от центров тригональной симметрии из-за большой величины параметра $\delta_t = 100$ К настолько велик, что компенсирует соответствующий статический вклад. В результате оказывается, что центры тригональной симметрии дают слабо зависящий от угла сдвиг H_{res} , приводящий к увеличению эффективного g -фактора. Наблюдаемый на эксперименте небольшой подъем H_{res} вблизи направления [110] при 4.2 К (рис. 2) может объясняться вкладом в H_{res} именно от центров тригональной симметрии.

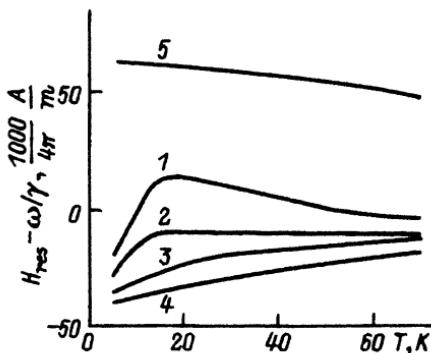


Рис. 8. Температурные зависимости суммарного вклада центров тригональной симметрии в H_{res} для образца № 2 вдоль направлений [110] (1), [112] (2), [111] (3) и [001] (4). Вклад эффекта электромагнитного распространения в H_{res} образца № 5 (5).

Температурные зависимости суммы статического и динамического вкладов центров тригональной симметрии в H_{res} для четырех кристаллографических направлений приведены на рис. 8. Статический вклад дает монотонное изменение H_{res} с температурой. Немонотонный характер температурных зависимостей H_{res} вдоль [112] и [110] связан с динамическим слагаемым и наблюдаемыми максимумами в температурной зависимости ΔH для этих направлений. Вдоль осей [001] и [111] H_{res} слабо зависит от температуры. Сохранение анизотропии до высоких температур объясняется, по-видимому, большой величиной параметра $\delta_t = 100$ К, определяющего энергию расщепления для центров тригональной симметрии.

В заключение остановимся на природе рассматриваемых примесных центров. К образованию центров смешанной валентности тригональной симметрии могут приводить вакансии по хрому или селену либо примеси замещения в октауэзлах решетки. В работе [12] было показано, что ртутная шпинель имеет очень узкую область гомогенности $\text{Hg}_{1-x}\text{Cr}_2\text{Se}_{4-x}$ вдали от стехиометрии с $x \approx 0.1$. По нашим измерениям [21], намагниченность насыщения HgCr_2Se_4 соответствует $5.83 \mu_B$ на элементарную ячейку вместо $6 \mu_B$ для иона Cr^{3+} , что может соответствовать концентрациям вакансий хрома ~ 0.06 . Исследуемые кристаллы являются сильно дефектными с концентрацией вакансий $\approx 10^{20} \div 10^{21} \text{ см}^{-3}$. Из этих оценок ясно, что лишь незначительная часть вакансий (менее одной сотой) ответственна за наблюданную наими анизотропию. Это свидетельствует о более сложных механизмах возникновения центров тригональной симметрии, в том числе и при замещении Se^{2-} ионами Cl^- , как обсуждалось в [12].

Наличие в кристалле центров кубической симметрии может быть связано с присутствием в тетрауэзлах шпинели случайной примеси ионов Fe^{2+} [3]. Однако проведенный рентгеновский анализ не выявил наличия железа в исследованных образцах. Поэтому мы предполагаем, что образование таких центров может быть связано и с замещением иона Hg^{2+} каким-либо трехвалентным ионом. Таким ионом может быть Al^{3+} , так как монокристаллы приготавлялись с использованием AlCl_3 в качестве транспортного агента.

Авторы благодарны А.Я. Фишману за полезные обсуждения и И.Ю.Шумилову за помощь в работе, а также В.В. Федоренко за исследования на содержание примеси железа в образцах.

Работа поддержана Международным научным фондом (ISF) и Американским физическим обществом.

Список литературы

- [1] Berger S.B., Pinch H.L. // J. Phys. Chem. Sol. 1968. V. 29. N 12. P. 2091–2099.
- [2] Гуревич А.Г., Эмириян Л.М., Васильев Л.Н., Оскотский В.С., Никифоров К.Г., Радауцан С.И., Тәзләвән В.Е. // Изв. АН СССР. Сер. физ. 1980. Т. 44. № 7. С. 1447–1450.
- [3] Hoekstra B., van Stapele R.P. // Phys. Stat. Sol. (b). 1973. V. 55. N 2. P. 607–613.
- [4] Эмириян Л.М., Гуревич А.Г., Шукюров А.С., Бержанский В.Н. // ФТТ. 1981. Т. 23. № 10. С. 2916–2922.
- [5] Никифоров К.Г., Гуревич А.Г., Эмириян Л.М. // ФТТ. 1985. Т. 27. № 1. С. 229–230.
- [6] Виглин Н.А., Самохвалов А.А., Солин Н.И., Симонова М.И. // ФТТ. 1984. Т. 26. № 4. С. 1230–1231.
- [7] Oldet H., Gibart P., Porte M., Merceron T., Villers G. // Ferrites: Proceedings of the International Conference. Japan, 1980. Р. 909–913.
- [8] Ferreira J.M., Coutinho-Filho M.D. // JMMM. 1986. V. 54–57. P. 1280–1282.
- [9] Солин Н.И., Самохвалов А.А., Шумилов И.Ю., Наумов С.В., Чеботаев Н.М. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 7. С. 2188–2193.
- [10] Солин Н.И., Самохвалов А.А., Шумилов И.Ю. // ФТТ. 1988. Т. 30. № 7. С. 2246–2248.
- [11] Яковлев Ю.М., Бурдин Ю.И., Шильников Ю.Р. // Изв. вузов. Радиоэлектроника. 1968. Т. 11. № 8. С. 834–836.
- [12] Чеботаев Н.М., Симонова М.И., Арбузова Т.И., Гижевский Б.А. // Изв. АН СССР. Неорг. материалы. 1985. Т. 21. С. 1468–1470.
- [13] Митрофанов В.Я., Фишман А.Я. // ФТТ. 1990. Т. 32. № 9. С. 2598–2605.
- [14] Иванов М.А., Митрофанов В.Я., Фальковская Л.Д., Фишман А.Я. // ФТТ. 1993. Т. 35. № 7. С. 2025–2036.
- [15] Иванов М.А., Фальковская Л.Д., Фишман А.Я. // Препринт ИМФ АН УССР. 1989; ФТТ. 1989. Т. 31. № 5. С. 211–219.
- [16] Ham F.S. // Electron Paramagnetic Resonance / Ed. S. Geshwind. Plenum Press, N.Y., London, 1972. P. 1–119.
- [17] Clogston A.M. // Bell Syst. Tech. J. 1955. V. 34. N 4. P. 739–76.
- [18] Скорецкий В.Г., Курбатов Л.В. // Сб. «Ферромагнитный резонанс». М.: Физматгиз, 1961. 343 с.
- [19] Гуревич А.Г. Магнитный резонанс в ферритах и антиферромагнетиках. Гл. 7. М.: Наука, 1973. 591 с.
- [20] Никифоров К.Г., Гуревич А.Г., Пасенко Л.Я., Радауцан С.И., Эмириян Л.М. // Письма в ЖЭТФ. 1987. Т. 46. № 2. С. 62–65.
- [21] Солин Н.И., Филиппов Б.Н., Шумилов И.Ю., Самохвалов А.А. // ФТТ. 1993. Т. 35. № 6. С. 1613–1623.

Институт физики металлов
УрО РАН
Екатеринбург

Поступило в Редакцию
6 апреля 1994 г.